

未知のケミカルイメージング領域を切り開く AFM-IR システム

AFM-IR& s-SNOM nano IR スペクトロスコピー 空間分解能 10nm ~ 50nm を可能にする局所赤外分光分析

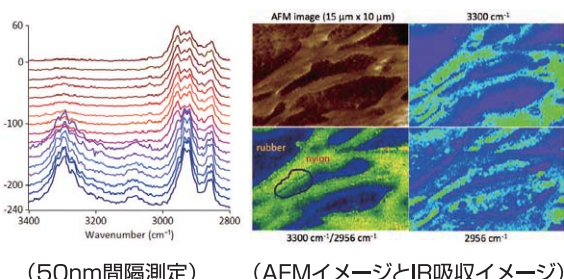


- FTIR と高い相関性を持つ真のモデルフリー IR 吸収スペクトロスコピー
- “Tapping AFM-IR” が可能にする分解能 10nm のケミカルイメージング
- “FastSpectra AFM-IR” は数秒で高分解能の nanoIR スペクトルを提供
- ナノスケール物性評価と多機能 AFM の相関顕微鏡機能
- 優れた操作性で、高い信頼性と生産性を同時に提供

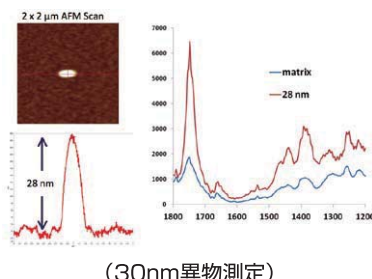
化学特性	熱特性	機械特性	表面形状
○IRスペクトル	○ガラス転移・融解温度	○硬さイメージ	○高さイメージ
○IR吸収イメージ	○転移温度マッピング	○DMA (粘弾性)	○位相イメージ
			○ラテラルイメージ

測定例

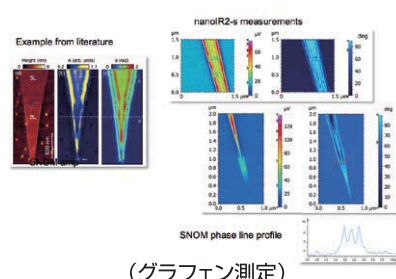
■ ゴムとナイロンブレンド境界分析



■ 基盤上異物



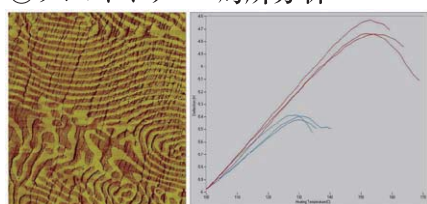
■ 2Dマテリアル分析



オプション

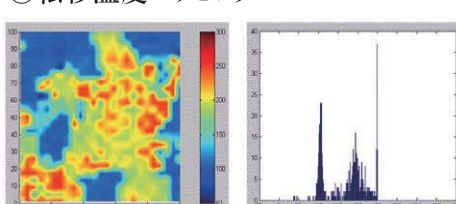
■ 熱分析(ナノサーマルアナリシス)

○ブレンドポリマー局所分析



(ドメイン/マトリックスの転移温度)

○転移温度マッピング



(アモルファスと結晶分析)

■ 機械特性分析

○カーボンファイバー/エポキシ境界分析

